

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-146887

(43)公開日 平成5年(1993)6月15日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
B 2 3 K 26/08	B	7920-4E		
26/00	B	7920-4E		
G 0 5 D 3/00	P	9179-3H		
3/12	W	9179-3H		

審査請求 未請求 請求項の数2(全6頁)

(21)出願番号 特願平3-336200

(22)出願日 平成3年(1991)11月26日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 高橋 利定

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

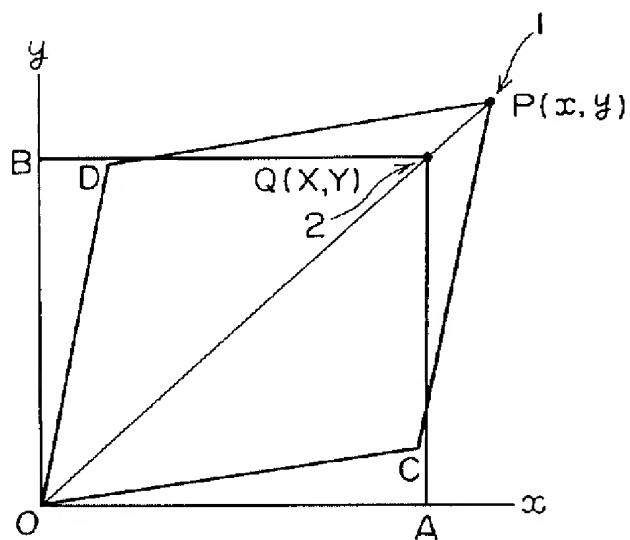
(74)代理人 弁理士 高橋 勇

(54)【発明の名称】スキヤニング型レーザマーカのマーキング制御方法

(57)【要約】

【目的】調整用の機構を排除し耐振動性を向上とともに短時間で直交度と平行度の調整が可能なスキヤニング型レーザマーカのマーキング制御方法。

【構成】第1のガルバノメータと第2のガルバノメータを用いてスキヤニング方式によりマーキングするスキヤニング型レーザマーカのマーキング制御方法において、第1及び第2のガルバノメータをそれぞれ操作してマーキングした直線がワークの位置決め機構の基準線であるx軸とのなす角度 α (ラジアン), β を計測し、一定条件のもとに直交座標系での位置に変換する。そして、マーキングの初期位置座標値と最終位置座標値から第1のガルバノメータと第2のガルバノメータの移動軸方向でのマーキング形状の微小変化量を算出し、レーザパルスに同期させて、算出された微小変化量を初期位置座標値に加えた座標値を、順次第1のガルバノメータと第2のガルバノメータに与え、レーザパルスがもたらす点列をオーバーラップさせてマーキングする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のガルバノメータと第2のガルバノメータを用いてスキャニング方法によりマーキングするスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方式において、前記第1のガルバノメータを独立に操作して一定長の直線をマーキングしこの直線がマーキングされるワークの位置決め機構の基準線であるx軸とのなす角度 α (ラジアン)を計測し、前記第2のガルバノメータを独立に操作して一定長の直線をマーキングしこの直線がマーキングされるワークの位置決め機構の基準線であるx軸とのなす角度 β (ラジアン)を計測し、 $\alpha \neq 0$ あるいは $\beta \neq \pi/2$ ときの直交座標系の原点と $\alpha = 0$ かつ $\beta = \pi/2$ のときの直交座標系の原点を一致させておき、 $\alpha \neq 0$ あるいは $\beta \neq \pi/2$ ときの直交座標系での位置をアフィン変換により $\alpha = 0$ かつ $\beta = \pi/2$ ときの直交座標系での位置に変換することを特徴とするスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方法。

【請求項2】 マーキングの初期位置座標値と最終位置座標値とから前記第1のガルバノメータと前記第2のガルバノメータの移動軸方向でのマーキング形状の微小変化量を算出し、一定微小時間ごとにレーザパルスに同期させて、算出された微小変化量を初期位置座標値に加えた座標値を順次前記第1のガルバノメータと前記第2のガルバノメータに与え、次々とレーザパルスがもたらす点列をオーバーラップさせてマーキングすることを特徴とする請求項1記載のスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、2つのガルバノメータを用いてスキャニング方式によりマーキングするスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 2つのガルバノメータを用いてスキャニング方式によりマーキングするスキャニング型レーザマーカにおいて、従来のマーキング制御方式では、2つのガルバノメータの取り付け位置によって決まる直交度およびガルバノメータ系とワーク位置決め機構とのなす角度によって決まる平行度を正確に出すために、次のようにして調整を行っていた。

【0003】(1) 直交度の調整:

【0004】①. 2つのガルバノメータを各自独立に動かして原点を通る2本の直線をマーキングする。

【0005】②. これら2本の直線が原点で交わる角度を測定する。

【0006】③. 2本の直線が交わる角度が $\pi/2$ になるように、ジンバル機構により2つのガルバノメータの相対的角度関係を試行錯誤的に繰り返し調整する。

【0007】(2) 平行度の調整:

【0008】ガルバノメータ系を固定しているベースを

取り付けている部分にあるクリアランスホールまたはガルバノメータ系を固定しているベースをθ方向にスライドさせる機構を利用して、上記の2本の直線のうち一方とワークが位置決めされる基準線の方向とのなす角度が0(ラジアン)になるようにベースの取り付け角度を試行錯誤的に調整する。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記従来例においては、ガルバノメータ系の取り付け位置で決まる直交度と平行度の調整を試行錯誤的に行っており、さらに直交度の調整のためのジンバル機構等が必要であるために、振動に弱くしかも調整に時間がかかるという不都合があった。

【0010】

【発明の目的】 本発明の目的は、かかる従来例の有する不都合を改善し、とくに調整用の機構を排除し耐振動性を向上するとともに短時間で直交度と平行度の調整が可能なスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方法を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】 そこで、本発明では、第1のガルバノメータと第2のガルバノメータを用いてスキャニング方式によりマーキングするスキャニング型レーザマーカのマーキング制御方法において、第1のガルバノメータを独立に操作して一定長の直線をマーキングしこの直線がマーキングされるワークの位置決め機構の基準線であるx軸とのなす角度 α (ラジアン)を計測し、第2のガルバノメータを独立に操作して一定長の直線をマーキングしこの直線がマーキングされるワークの

位置決め機構の基準線であるx軸とのなす角度 β (ラジアン)を計測し、 $\alpha \neq 0$ あるいは $\beta \neq \pi/2$ ときの直交座標系の原点と $\alpha = 0$ かつ $\beta = \pi/2$ ときの直交座標系の原点を一致させておき、 $\alpha \neq 0$ あるいは $\beta \neq \pi/2$ ときの直交座標系での位置をアフィン変換により $\alpha = 0$ かつ $\beta = \pi/2$ ときの直交座標系での位置に変換するとともに、マーキングの初期位置座標値と最終位置座標値とから第1のガルバノメータと第2のガルバノメータの移動軸方向でのマーキング形状の微小変化量を算出し、一定微小時間ごとにレーザパルスに同期させて、算出された微小変化量を初期位置座標値に加えた座標値を順次第1のガルバノメータと第2のガルバノメータに与え、次々とレーザパルスがもたらす点列をオーバーラップさせてマーキングするという構成を探っている。これによって前述した目的を達成しようとするものである。

【0012】

【作用】 まず各ガルバノメータを独立に一定長だけ直線をマーキングして、この2つの各直線がマーキングされるワークの位置決め機構の基準線であるx軸となす角度すなわち α と β (ラジアン)を計測する。 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ のときはガルバノメータとワークの位置決め機構

との間の平行度が出ていて、しかも2つのガルバノメータが直交しているので、座標変換の必要はなくあるパターンをマーキングすると指定した通りの角度と長さを持つ正確なパターンが得られる。しかしながら $\alpha \neq 0$ あるいは $\beta \neq \pi/2$ ときはこの場合の直交座標系を Ω とし、 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ のときに決まる直交座標系を Ω_0 としこれら2つの座標系 Ω_0 と Ω の原点を一致させておき、座標系 Ω_0 での位置(x, y)を次式を用いて座標系 Ω での位置(X, Y)に変換する。

【0013】

$$X = (x \sin \beta - y \cos \beta) / \sin(\beta - \alpha)$$

【0014】

$$Y = (-x \sin \alpha + y \cos \alpha) / \sin(\beta - \alpha)$$

【0015】次にマーキングする場合には初期位置から一定時間 Δt ごとにX、Yともに微小量 ΔX 、 ΔY ずつ*

$$\Delta X = -v \cos(nv/r \Delta t + \theta s - \beta) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

【0021】

$$\Delta Y = v \cos(nv/r \Delta t + \theta s - \alpha) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

【0022】ここで、nは増加回数であり $1 \leq n \leq N$ の値をとる。ただしNは θ が θ_e に一致するときの増加回数である。

【0023】

【発明の実施例】以下、本発明の一実施例を図1ないし図4に基づいて説明する。

【0024】レーザマーカにおける光学部は、固定された2つのガルバノメータと、ビームエキスパンダと、反射ミラーと、fθレンズと、2つのガルバノメータとレーザを制御するとともに移動指定量を補正するソフトウェアとから構成されている。

【0025】次に、本実施例の動作について説明する。

【0026】ここでは、2つのガルバノメータを独立に移動させてマーキングした場合に描かれる線が原点で交わる2本の歪のない直線となり、指定した位置に指定した通りの長さで描かれるようにシステムゲイン(指定長に対する実際のマーキング長の割合)が正しくすでに調整されているものとする。

【0027】マーキングされるワークが位置決めされる基準線の方向をx軸とするワーク座標としての直交座標系を(x, y)とし、2つのガルバノメータの取り付け角度によって決まるマーキング平面上の機械座標系の2つの軸をX軸、Y軸とし、X軸とY軸がx軸となす角度をそれぞれ α 、 β (ラジアン)とする。

【0028】また2つのガルバノメータは機械的にホルダーに固定されているものとする。

【0029】①. まず各ガルバノメータを独立に一定長 p (mm)だけ直線をマーキングして、この2つの各直線がマーキングされるワークの位置決め機構の基準線であるx軸となす角度すなわち α と β (ラジアン)を計測する。ここで平行度および直交度に関する機構組立の精度としては、あと微調整を要するだけの範囲にあるもの※50

* 増加させた値をレーザパルスに同期させて順次各々X軸、Y軸のガルバノメータに与えていくことにより、次々にレーザパルスがもたらす点列をオーバーラップさせて加工させていき、最終的に目標位置に到達する。

【0016】ここでx軸と角度 ϕ をなす角度の直線を速度 v でマーキングする場合には ΔX 、 ΔY は次式で求められる。

【0017】

$$\Delta X = v \sin(\beta - \phi) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

10 【0018】

$$\Delta Y = v \sin(\alpha - \phi) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

【0019】また原点に中心を持つ円弧(半径 r 、 $\theta_s \leq \theta \leq \theta_e$)円弧をマーキングする場合には次式で求められる。

【0020】

$$\Delta X = -v \cos(nv/r \Delta t + \theta s - \beta) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

【0021】

$$\Delta Y = v \cos(nv/r \Delta t + \theta s - \alpha) / \sin(\beta - \alpha) \Delta t$$

※とする。すなわち、 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ であるとする。

20 【0030】②. α と β の計測値に基づいて座標変換を行う。これは、以下の(a) (b)に分けられる。

【0031】(a) $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ のとき: このときはガルバノメータとワークの位置決め機構との間の平行度が出ていて、しかも2つのガルバノメータが直交しているので、座標変換の必要はなくあるパターンをマーキングすると指定した通りの角度と長さを持つ正確なパターンが得られる。

【0032】図2に示されるように、2つのガルバノメータを各々独立に移動させてマーキングした場合に、描かれる直線が直交しかつワーク位置決め機構と平行であり、その上システムゲインが正しいときは、長方形と円を指定した場合に長方形と円が正しく描かれている。

【0033】(b). 上記(a)以外の一般的な場合: 図3に示されるように、2つのガルバノメータを各々独立に移動させてマーキングした場合に、描かれる直線が直交しないかワーク位置決め機構と平行でないとき、長方形と円を指定した場合に長方形が平行四辺形として、また円が橢円として描かれている。

【0034】この場合の直交座標系を Ω とし、 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ のときに決まる直交座標系すなわち上記(a)のワーク座標を Ω_0 とする。ここではこれら2つの座標系 Ω_0 と Ω の原点を一致させておく。

【0035】図4に示されるように座標系 Ω_0 での点(x, y)と座標系 Ω での点(X, Y)が同一の点を表しているときの関係は、座標系 Ω_0 での基本ベクトルを(i, j)、座標系 Ω での基本ベクトルを(k, l)とすると以下のように表すことができる。

$$[0036] x i + y j = X k + Y l$$

$$[0037] k = \cos \alpha i + \sin \alpha j$$

$$[0038] l = \cos \beta i + \sin \beta j$$

【0072】(c) 直線と円弧からなる任意のパターンをマーキングする場合：各々式(6A)(6B)および式(11A)(11B)で示される ΔX と ΔY だけ、 Δt ごとにガルバノメータの位置座標値を増加していくことにより、指定通りの形状のパターンをマーキングすることができる。

【0073】このことは、 $\alpha = 0$ 、 $\beta = \pi/2$ に正規の微調整がなされていなくても、指定通りのパターンをマーキングできることを示している。

【0074】

【発明の効果】本発明は以上のように構成され機能するので、これによると、ガルバノメータの取り付け角度を調整するジンバル機構やガルバノメータホルダーを固定しているベースをスライドさせる機構が不要なため、振動に対して強い固定ができるとともに2つのガルバノメータを各々独立に動かして原点を通る2本の直線をマーキングしたとき、2本の各直線がワーク座標の基準の方向となす角度を測定するだけで無調整のままガルバノメータ系の直交性とワーク位置決め機構との間の平行性をもっているかのようにマーキングできるため、短時間でマーキングが行えるという従来にない優れたスキヤニン

グ型レーザマーカのマーキング制御方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における座標変換の説明図である。

【図2】本発明の一実施例において2つのガルバノメータを独立に移動させてマーキングしたときに描かれる直線が直交し、ワーク位置決め機構との平行度が出ており、かくシステムゲインが正しいときの座標系の説明図である。

【図3】本発明の一実施例において2つのガルバノメータを独立に移動させてマーキングしたときに描かれる直線が直交しないか、あるいはワーク位置決め機構との平行度が出てないときの座標系の説明図である。

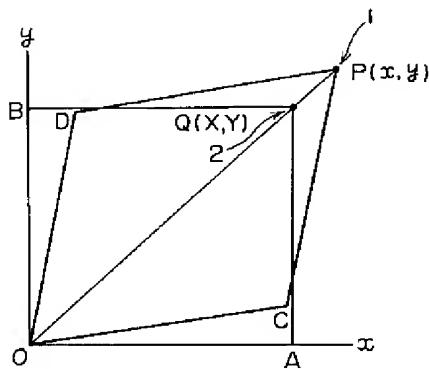
【図4】本発明におけるアフィン変換の説明図である。

【符号の説明】

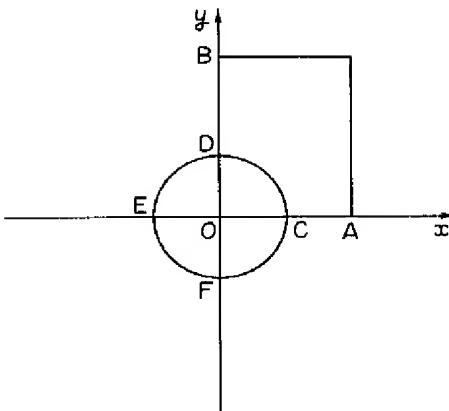
α 第1のガルバノメータでマーキングした直線とX軸とのなす角

β 第2のガルバノメータでマーキングした直線とX軸とのなす角

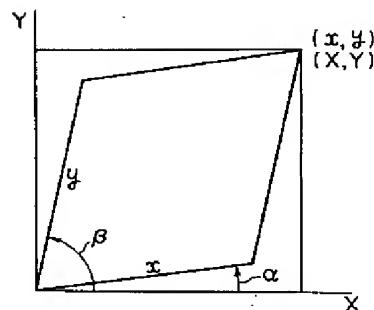
【図1】



【図2】

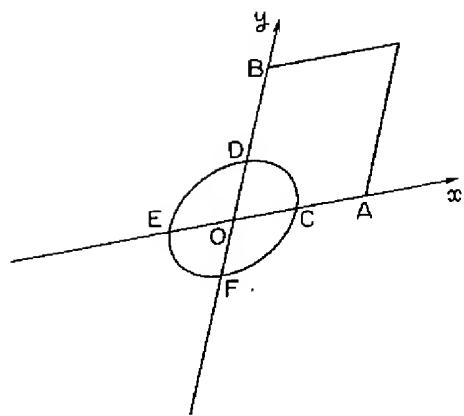


【図4】



α ---第1のガルバノメータでマーキングした直線とX軸とのなす角
 β ---第2のガルバノメータでマーキングした直線とX軸とのなす角

【図3】



PAT-NO: JP405146887A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05146887 A
TITLE: MARKING CONTROL METHOD FOR
SCANNING TYPE LASER BEAM
MARKER
PUBN-DATE: June 15, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TAKAHASHI, TOSHISADA	

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
NEC CORP	N/A

APPL-NO: JP03336200

APPL-DATE: November 26, 1991

INT-CL (IPC): B23K026/08 , B23K026/00 ,
G05D003/00 , G05D003/12

US-CL-CURRENT: 219/121.68

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the marking control method of the scanning type laser beam marker which eliminates an adjusting mechanism improves vibration resistance and adjusts the orthogonality and parallelism in a short time.

CONSTITUTION: In the marking control method of the scanning type laser beam marker to perform marking by a scanning system by using a first galvanometer and a second galvanometer, the first and second galvanometers are operated, respectively to measure angles α (radian) and β formed between a marked straight line and an X axis which is a reference line of a positioning mechanism of a work and convert these into the position at an orthogonal coordinate system under a specified condition. The minute variations of a marking shape in the mobile axial direction of the first galvanometer and the second galvanometer are them calculated from an initial position coordinate value and a final position coordinate value of marking which are synchronized with a laser beam pulse. A coordinate value obtained by adding the calculated minute variations to the initial position coordinate value is given to the first galvanometer and the second galvanometer in order, the sequence of points produced by the laser beam pulse is overlapped and marking is performed.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio